

NEWS RELEASE**抵抗値を約 20%削減し、半導体検査時の電圧低下を低減する
「低抵抗プローブ」を新開発**

～ 長年培ってきたヨコオの独自技術を集結し、従来比 20%減を実現 ～



約 20%抵抗値を削減した「低抵抗プローブ」

株式会社ヨコオ(本社:東京都千代田区、社長:徳間孝之)は、このたび、半導体検査で使用するプローブの、構造そのものから、プランジャーの先端形状やばね構造までを見直すことで、**従来品に比べ抵抗値を約 20%削減する「低抵抗プローブ」を開発しました。**

半導体検査で使用される一般的なプローブは、金属製のチューブとばね、それとプランジャーと呼ばれる金属部品がチューブの両端にそれぞれついており、合計 4 つの部品で構成されています。

両端のプランジャーは、チューブ内部のばねの伸縮により上下に可動する構造になっており、このプランジャーが半導体に直接接触し電気を流すことで検査を行います。

新開発の低抵抗プローブは、まず、プランジャーの可動を片側だけにする、片可動プローブを採用することに加え、ばね荷重を高くすることで抵抗値を大幅に削減しています。さらにそれら既存技術に加え、プランジャーの先端形状とばね構造を最適化することで、プランジャーと基板との抵抗値の削減を図っています。

長年プローブ製造を行い培ってきたノウハウを生かし、既存技術と新規技術を組み合わせ、一つひとつの部品を丁寧に見直し、微細な技術を積み重ねることで、従来品より約 20%削減した低抵抗プローブを開発することができました。

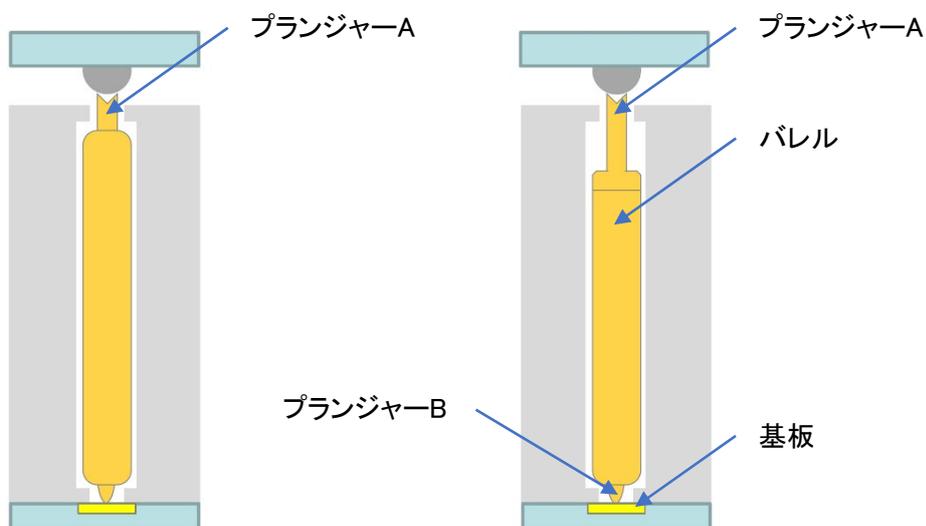
半導体は、年々高度化していることに加え、省電力化も進んでいます。今後、さらなる省電力化が進むと、現在使用しているプローブでは、検査時に電圧低下を引き起こす可能性が考えられます。

また通常の検査工程においても、プローブの抵抗値が低いと安定した検査を行うことができるため、低抵抗プローブの技術を他プローブにも応用する事で、安定的な検査工程を提供することが可能になります。

ヨコオはこれからも、長年培ってきたコア技術を生かし、今後も高度化する半導体の検査工程において、安定した検査工程を提供できるよう貢献してまいります。

<参考資料>

■ 従来品との比較



従来品：両可動プローブ

新規開発品：片可動プローブ

■ 特徴

- ・ 片可動を採用することに加え、ばね荷重を高め抵抗値を削減
⇒片可動タイプは、プランジャーA とバレルが同時に可動します
- ・ プランジャーB の先端形状とばね構造を最適化し、抵抗値を削減

(注) ニュースリリースに記載されている内容は報道発表日時点の情報です。その後、予告なしに変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。

◇ 販売に関するお問い合わせ先
株式会社ヨコオ CTC 事業部 営業部
TEL: 03-3916-3116
HP: <https://www.yokowo.co.jp/inquiry/>

◇ 本件に関するお問い合わせ先
株式会社ヨコオ 広報・株式部 松本 / 禪院(ぜんいん)
TEL: 03-3916-3179
携帯: 080-2275-3255(松本)
E-mail: h-matsumoto@jp.yokowo.com